

Изобретение относится к электроизмерительной технике и радиоэлектронике и может быть использовано в производстве электропроводов, например, литых микропроводов, полученных путем их вытягивания из жидкой фазы металлов или сплавов, а также для их покрытия стеклянной оболочкой и изоляцией в процессе литья.

Способ позволяет получить провод заданного сечения и заданной однородности с очень высокой точностью, что обеспечивает получение проводов высокого качества.

Способ заключается в том, что в течение всего процесса их литья непрерывно измеряют сечение жилы вытягиваемого провода путем его сравнения с сечением образцового провода, корректируют имеющиеся отклонения реального сечения получаемого провода от образцового путем изменения режима его литья, для чего, через получаемый провод, последовательно, в равные промежутки времени пропускают соответственно токи значений $i(t)$ и $i(t)/2$, при этом ток значением $i(t)$ пропускают через участок вытягиваемого провода определенной длины, а ток значением $i(t)/2$ пропускают через последовательную цепь, состоящую из выше названного участка получаемого провода и образцового провода сечением и длиной заданного значения; сравнивают падения напряжений на этих участках провода, затем напряжением, равным их разнице, воздействуют на устройство литья провода, изменяя его режим до тех пор, пока сечение получаемого провода не станет равным образцовому сечению.

П. формулы: 1

Фиг.: 2